

A new measure for calculating multiple fault coverage of microprocessor self-test

Oyeniran, Adeboye Stephen; Odozi, Uzochukwu Eddie; Ubar, Raimund-Johannes BEC 2016 : 2016 15th Biennial Baltic Electronics Conference : proceedings of the 15th Biennial Baltic Electronics Conference : Tallinn University of Technology, October 3-5, 2016, Tallinn, Estonia 2016 / p. 75-78 : ill http://www.ester.ee/record=b2150914*est

Applications of modern DSP processors

Kalinina, Tatjana Raadiotehnika 2001 : VIII rahvusvahelise telekommunikatsioonipäeva materjalid 2001 / lk. 84-89 : ill

Asünkroonsed protsessid

Toomsalu, Arvo A & A 2003 / 1, lk. 7-23 : ill https://artiklid.elnet.ee/record=b1011904*est

Automated software-based in-field self-test program synthesis

Jasnetski, Artjom; Ubar, Raimund-Johannes; Tšertov, Anton International journal of microelectronics and computer science 2017 / p. 57-64 : ill

Automated software-based self-test generation for microprocessors

Jasnetski, Artjom; Ubar, Raimund-Johannes; Tšertov, Anton Proceedings of the 24th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems : MIXDES 2017 : Bydgoszcz, Poland, June 19-21, 2014 2017 / p. 453-458 : ill
<https://doi.org/10.23919/MIXDES.2017.8005252>

Automation of testing beyond the SoCs

Tšertov, Anton; Jutman, Artur; Devadze, Sergei Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorikooli IKTDK neljanda aastakonverentsi artiklite kogumik : 26.-27. novembril 2010, Essu mõis 2010 / lk. 29-32 : ill

Combined pseudo-exhaustive and deterministic testing of array multipliers

Oyeniran, Adeboye Stephen; Azad, Siavoosh Payandeh; Ubar, Raimund-Johannes 2018 IEEE International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics (AQTR) : THETA 21st edition, 24th-26th May, Cluj-Napoca, Romania : proceedings 2018 / 6 p. : ill <https://doi.org/10.1109/AQTR.2018.8402708>

Control intensive digital system synthesis

Tammemäe, Kalle 1997 http://www.ester.ee/record=b1060033*est

Development of a power electronics controller with RISC-V based core for security-critical applications

Swakath, S. U.; Kshirsagar, Abhijit; Kondepu, Koteswararao; Banavath, Satish Naik; **Chub, Andrii; Vinnikov, Dmitri** 2022 IEEE 63th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON): conference proceedings 2022 / p. 1-5 <https://doi.org/10.1109/RTUCON56726.2022.9978737>

A DFT scheme to improve coverage of hard-to-detect faults in FinFET SRAMs

Cardoso Medeiros, Guilherme; **Gürsoy, Cemil Cem**; Fieback, Moritz; Wu, Lizhou; **Jenihhin, Maksim**; Taouil, Mottaqiallah; Hamdioui, Said 2020 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 9-13 March 2020, Grenoble, France : proceedings 2020 / p. 792-797 <https://doi.org/10.23919/DATE48585.2020.9116278>

Diagnostic modeling of microprocessors with high-level decision diagrams

Ubar, Raimund-Johannes; Raik, Jaan; Jutman, Artur; Jenihhin, Maksim; Brik, Marina; Istenberg, Martin; Wuttke, Heinz-Dietrich BEC 2008 : 2008 International Biennial Baltic Electronics Conference : proceedings of the 11th Biennial Baltic Electronics Conference : Tallinn University of Technology : October 6-8, 2008, Tallinn, Estonia 2008 / p. 147-150 : ill

Dünaamiliselt rekonfigureeritava struktuuriga mikroprotssessor

Toomsalu, Arvo A & A 2004 / 6, lk. 8-13 : ill

Epsoni asünkroonne mikroprotssessor

Toomsalu, Arvo A & A 2005 / 2, lk. 66-67

Hardware and software of the IGBT power converter

Lehtla, Madis Actual Problems of Electrical Drives and Industry Automation : the research symposium of young scientists : Tallinn, Estonia, May 31 - June 5, 1999 1999 / p. 67-70: ill

Hardware trojan insertion in finalized layouts : from methodology to a silicon demonstration

Perez, Tiago Diadami; Pagliarini, Samuel Nascimento IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems 2023 / p. 2094-2107 <https://doi.org/10.1109/TCAD.2022.3223846> [Journal metrics at Scopus](#) [Article at Scopus](#) [Journal metrics at WOS](#) [Article at WOS](#)

High-level combined deterministic and pseudo-exhaustive test generation for RISC processors

Oyeniran, Adeboye Stephen; Ubar, Raimund-Johannes; Jenihhin, Maksim; Gürsoy, Cemil Cem; Raik, Jaan 2019 IEEE European Test Symposium (ETS) : proceedings 2019 / 6 p. : ill <https://doi.org/10.1109/ETS.2019.8791526>

High-level fault diagnosis in RISC processors with Implementation-Independent Functional Test

Oyeniran, Adeboye Stephen; Jenihhin, Maksim; Raik, Jaan; Ubar, Raimund-Johannes 2022 IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI (ISVLSI) : Nicosia, Cyprus : 04-06 July 2022 / p. 32-37 <https://doi.org/10.1109/ISVLSI54635.2022.00019>

High-level functional test generation for microprocessor modules

Oyeniran, Adeboye Stephen; Ubar, Raimund-Johannes Proceedings of 26th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems : MIXDES 2019 : Rzeszów, Poland, June 27 - 29, 2019 / p. 356-361 : ill <https://doi.org/10.23919/MIXDES.2019.8787131>

High-level implementation-independent software-based self-test for RISC type microprocessors = Mikroprotsessorite tarkvarapõhine implementatsioonist mittesõltuv funktsionaalne enesekontroll

Oyeniran, Adeboye Stephen 2020 <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/08a75fbb-3f71-4fe4-b3d0-3f37a9a5f36d>

High-level modeling and testing of multiple control faults in digital systems

Jasnetski, Artjom; Oyeniran, Adeboye Stephen; Tšertov, Anton; Schölzel, Mario; Ubar, Raimund-Johannes Formal proceedings of the 2016 IEEE 19th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems (DDECS) : April 20-22, 2016, Košice, Slovakia 2016 / [6] p. : ill <http://dx.doi.org/10.1109/DDECS.2016.7482445>

High-level test data generation for software based self-test in microprocessors

Oyeniran, Adeboye Stephen; Jasnetski, Artjom; Tšertov, Anton; Ubar, Raimund-Johannes 2017 6th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO) : including ECYPS'2017 : proceedings : research monograph : Bar, Montenegro, June 11th-15th, 2017 / p. 86-91 : ill <https://doi.org/10.1109/MECO.2017.7977167>

Implementation-independent functional test for transition delay faults in microprocessors

Oyeniran, Adeboye Stephen; Ubar, Raimund-Johannes; Jenihhin, Maksim; Raik, Jaan 2020 23rd Euromicro Conference on Digital System Design (DSD), 26-28 August 2020, Kranj, Slovenia 2020 / p. 646-650 <https://doi.org/10.1109/DSD51259.2020.00105>

Implementation-independent functional test generation for RISC microprocessors

Oyeniran, Adeboye Stephen; Ubar, Raimund-Johannes; Jenihhin, Maksim; Raik, Jaan VLSI-SoC 2019 : 27th IFIP/IEEE International Conference on Very Large Scale Integration : [proceedings] 2019 / p. 82-87 : ill <https://doi.org/10.1109/VLSI-SoC.2019.8920323>

In-system programming of non-volatile memories on microprocessor-centric boards

Tšertov, Anton; Devadze, Sergei; Jutman, Artur; Jasnetski, Artjom International journal of microelectronics and computer science 2014 / p. 25-34 : ill

Itanium : [serverid ja tööjaamad 64bitise protsessori Itanium baasil]

Leis, Paul A & A 2001 / 3, lk. 3-4

Kergrööbassõidukite ajamid ja juhtimine

Laugis, Juhan; Lehtla, Tõnu; Joller, Jüri; Rosin, Argo; Vinnikov, Dmitri; Lehtla, Madis 2008 http://www.ester.ee/record=b2394445*est

Kes oli esimese mikroprotsessori looja?

Toomsalu, Arvo A & A 1999 / 2, lk. 8-11

Kognitiivelektronika on elektroonika tulevik

Maidla, Margus Sirp 2016 / lk. 34-35 : fot <http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/kognitiivelektronika-on-elektronika-tulevik/>

Laboratory framework TEAM for investigating the dependability issues of microprocessor systems

Jasnetski, Artjom; Tšertov, Anton; Ubar, Raimund-Johannes; Kruus, Helena 10th European Workshop on Microelectronics Education : EWME 2014 : May 14-16, 2014, Tallinn, Estonia 2014 / p. 80-83 : ill

Logic IP for low-cost IC design in advanced CMOS nodes

Isgenc, Mehmet Meric; Martins, Mayler G.A.; Zackriya, V. Mohammed; Pagliarini, Samuel Nascimento; Pileggi, Larry IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems 2020 / p. 585-595 <https://doi.org/10.1109/TVLSI.2019.2942825>

Medium-voltage frequency converters microprocessor control system

Mälter, Meelis; Joller, Jüri Actual Problems of Electrical Drives and Industry Automation : the research symposium of young scientists : Tallinn, Estonia, May 31 - June 5, 1999 / p. 63-66: ill

Microprocessor based traction control system and diagnostic algorithms for the traction drive TVM1

Lehtla, Madis Symposium "Topical Problems of Education in the Field of Electrical and Power Engineering" : Kuressaare, Estonia, January 19-24, 2004 / p. 58-61 : ill

Microprocessor control systems of light rail vehicle traction drives

Lehtla, Madis 2006 https://www.ester.ee/record=b2170586*est

Microprocessor-based system test using debug interface

Devadze, Sergei; Jutman, Artur; Tšertov, Anton; Instenberg, Martin; Ubar, Raimund-Johannes 26th Norchip Conference : Tallinn, Estonia, 17-18 November 2008 : formal proceedings 2008 / p. 98-101 : ill <http://dx.doi.org/10.1109/NORCHIP.2008.4738291>

Microprocessors and microsystems : MICPRO : embedded hardware design

2010

Mikroarvutid automaatikas

Ariste, Andri; Lind, H.; Mõtus, Leo; Tani, H. 1984 https://www.ester.ee/record=b1245439*est

Mikroprozessorsystem zur Steuerung über zweimotorigen Elektroantriebes

Laugis, Juhan; Pettai, Elmo; Oorn, Hillar 10. Internationale Fachtagung Industrielle Automatisierung - Automatisierte Antriebe : 14. Februar bis 16. Februar 1989 in Karl-Marx-Stadt 1989 / S. 72-75

Mikroprotsessor Tehnikaülikoolist transistori 50. sünnipäevaks

Ubar, Raimund-Johannes Horisont 1997 / 8, lk. 10-11: ill

Mikroprotsessori ajaloost

Toomsalu, Arvo Arvutimaailm 1995 / 1, lk. 38-40; 2, lk. 28-30 : ill

Mikroprotsessori K580 käsustik koos kasutamishisega : abimaterjal laboratoorsete tööde sooritamiseks

1988 https://www.ester.ee/record=b1232546*est

Mikroprotsessori K580 käsustik koos kasutamishistega : abimaterjal laboratoorsete tööde sooritamiseks

1990 https://www.ester.ee/record=b1250156*est

Mikroprotsessorite kasutamisest elektrisüsteemide kateedri õppelaboratooriumites

Lelumees, Heino; Tammoja, Heiki Arvutite ja tehniliste vahendite kasutamine õppetöös : TPI 50. aastapäevale pühendatud teaduslik-metoodilise konverentsi, 26.-27. märtsil : ettekannete teesid 1986 / lk. 77-78 https://www.ester.ee/record=b1206593*est

Mikroprotsessorsüsteemid : kursuseprojekti juhendmaterjal

Toomsalu, Arvo 1998 https://www.ester.ee/record=b1061287*est

Mikroprotsessorsüsteemid : kursuseprojekti metoodiline juhend

Toomsalu, Arvo 1996 https://www.ester.ee/record=b1619347*est

Mikroprotsessorsüsteemide programmeerimine

Märtn, Kaarel; Mõtus, Leo Tehnika ja Tootmine 1985 / lk. 11-13 https://www.ester.ee/record=b1073047*est

Mikroprotsessorsüsteemide projekteerimine : laboratoorsete tööde juhend

1992 https://www.ester.ee/record=b1061875*est

Mikroprotsessortehnika

Lehtla, Tõnu; Kulmar, Lembit 1995 https://www.ester.ee/record=b1054894*est

Mikroprotsessortehnika ja tehniline progress

Keevallik, Andres Rahva Hääl 1984 / lk. [?] https://www.ester.ee/record=b1072826*est

Minimization of the high-level fault model for microprocessor control parts [Online resource]

Ubar, Raimund-Johannes; Oyeniran, Adeboye Stephen; Medaiyese, Olusiji BEC 2018 : 2018 16th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC) : proceedings of the 16th Biennial Baltic Electronics Conference, October 8-10, 2018 2018 / 4 p.: ill <https://doi.org/10.1109/BEC.2018.8600980>

Mixed-level identification of fault redundancy in microprocessors

Oyeniran, Adeboye Stephen; Ubar, Raimund-Johannes; Jenihhin, Maksim; Gürsoy, Cemil Cem; Raik, Jaan LATS 2019 : 20th IEEE Latin American Test Symposium : Santiago, Chile, March 11th - 13th 2019 2019 / 6 p. : ill <https://doi.org/10.1109/LATW.2019.8704591>

MSP430 as an introductory training microcontroller

Galkin, Ilja 2nd International Symposium "Topical Problems of Education in the Field of Electrical and Power Engineering" : Kuressaare, Estonia, January 17-22, 2005 2005 / p. 123-126

Muutused protsessorite ja PC-de võitlustandril

Tammemäe, Kalle A & A 1999 / 3, lk. 7-14: ill https://artiklid.elnet.ee/record=b1001307*est

New fault models and self-test generation for microprocessors using High-Level Decision Diagrams

Jasnetski, Artjom; Raik, Jaan; Tšertov, Anton; Ubar, Raimund-Johannes 2015 IEEE 18th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems DDECS 2015 : 22-24 April 2015, Belgrade, Serbia : proceedings 2015 / p. 251-254 : ill

On automatic software-based self-test program generation based on high-Level decision diagrams

Jasnetski, Artjom; Ubar, Raimund-Johannes; Tšertov, Anton LATS 2016 : 17th IEEE Latin-American Test Symposium, Foz do Iguacu, Brazil, 6th-9th April 2016 2016 / p. 177 <http://dx.doi.org/10.1109/LATW.2016.7483357>

On test generation for microprocessors for extended class of functional faults

Oyeniran, Adeboye Stephen; Ubar, Raimund-Johannes; Jenihhin, Maksim; Raik, Jaan VLSI-SoC: New technology enabler : 27th IFIP WG 10.5/IEEE International Conference on Very Large Scale Integration, VLSI-SoC 2019 Cusco, Peru, October 6–9, 2019 : Revised and Extended Selected Papers 2020 / p. 21-44 <https://doi.org/10.1007/978-3-030-53273-4> [Conference proceedings at Scopus](#) [Article at Scopus](#)

Orgaaniline mikroprotsessor

Toomsalu, Arvo A & A 2011 / lk. 18-21 : ill

Parallel pseudo-exhaustive testing of array multipliers with data-controlled segmentation

Oyeniran, Adeboye Stephen; Azad, Siavoosh Payandeh; Ubar, Raimund-Johannes 2018 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS) : 27-30 May 2018, Florence, Italy : proceedings 2018 / 5 p.: ill <https://doi.org/10.1109/ISCAS.2018.8350936> [Conference proceedings at Scopus](#) [Article at Scopus](#) [Article at WOS](#)

Personaalarvutid mikroprotsessoril 80486. Sise- ja välisseadmete liidesed, matemaatikaprotsessorid, jõudlusteid

Toomsalu, Arvo 1992 https://www.ester.ee/record=b1064225*est

PIC microcontroller learning system

Jalakas, Tanel; Möller, Taavi; Roasto, Indrek 3rd International Symposium "Topical Problems of Education in the Field of Electrical and Power Engineering" : Doctoral School of Energy and Geotechnology : Kuressaare, Estonia, January 16-21, 2006 2006 / p. 99-101 : ill

Pingviiniprotsessor

Tammemäe, Kalle A & A 1999 / 6, lk. 8-11 https://artiklid.elnet.ee/record=b1002707*est

Post-RISC-arhitektuur

Toomsalu, Arvo A & A 2001 / 2, lk. 8-14 ; 3, lk. 7-16 https://artiklid.elnet.ee/record=b1006602*est

Protsessor mälus

Toomsalu, Arvo A & A 2001 / 4, lk. 9-16 https://artiklid.elnet.ee/record=b1007646*est

RISC-mikroprotsessorid reaajasüsteemides

Toomsalu, Arvo Arvutustehnika ja Andmetöötlus 1994 / 10, lk. 2-5 ; 11, lk. 2-6

RISC-mikroprotsessorite arhitektuur

Toomsalu, Arvo 1995 https://www.ester.ee/record=b1069536*est

Runtime contention and bandwidth-aware adaptive routing selection strategies for networks-on-chip

Samman, Faizal; Hollstein, Thomas; Glesner, Manfred IEEE transactions on parallel and distributed systems 2013 / p. 1411-1421 : ill

Software-based self-test for microprocessors with high-level decision diagrams = Mikroprotsessorite tarkvara-põhine enesetestimine kõrgtasandi otsustusdiagrammide põhjal

Jasnetski, Artjom 2018 <https://digi.lib.ttu.ee/ii/?10629>

Software-based self-test generation for microprocessors with high-level decision diagrams

Jasnetski, Artjom; Ubar, Raimund-Johannes; Tšertov, Anton; Brik, Marina Proceedings of the Estonian Academy of Sciences 2014 / p. 48-61 : ill https://artiklid.elnet.ee/record=b2665215*est

Software-based self-test generation for microprocessors with high-level decision diagrams

Ubar, Raimund-Johannes; Tšertov, Anton; Jasnetski, Artjom; Brik, Marina LATW2014 : 15th IEEE Latin-American Test Workshop : Fortaleza, Brazil, March 12th-15th, 2014 2014 / [6] p. : ill

Software-based self-test with decision diagrams for microprocessors

Ubar, Raimund-Johannes; Jasnetski, Artjom; Tšertov, Anton; Oyeniran, Adeboye Stephen 2018

SPARC-V8- ja V9-arhitektuuriga mikroprotsessorid

Toomsalu, Arvo Arvutustehnika ja Andmetöötlus 1995 / 7, lk. 14-23: ill

Stepper motor drive as a control object for teaching microprocessor control of electrical drives

Kährik, Rainer; **Lehtla, Madis** 6th International Symposium "Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering" : Doctoral School of Energy and Geotechnology : [Kuressaare, January 12-17, 2009] 2009 / p. 140-143 : ill

SuperH-arhitektuuriga protsessortuum kiipsüsteemidele

Toomsalu, Arvo A & A 2001 / 1, lk. 11-18 : ill https://artiklid.elnet.ee/record=b1006239*est

Z-RAM-mälu

Toomsalu, Arvo A & A 2008 / 3, lk. 10-19 https://artiklid.elnet.ee/record=b1022321*est

Teaching digital system test

Oyeniran, Adeboye Stephen; **Ubar, Raimund-Johannes**; **Kruus, Margus** The 27th EAAEIE Annual Conference : June 7-9, 2017, Grenoble 2017 / [6] p

Test generation for microprocessor control mechanisms

Lohuaru, Tõnu; **Ubar, Raimund-Johannes** FTSD-10 : Deseta Mezdunarodnaja Konferencija "Nadezdnost i Diagnostika na ECM. Mikrokomputri i Sistemi", Varna, Bulgaria, 1987 = 10th International Conference on Fault-Tolerant Systems and Diagnostics (1987) 1987 / p. 305-311

Test generation for microprocessors on alternative graphs

Alango, Villem; **Kont, Toomas**; **Ubar, Raimund-Johannes** 33. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium : 24.-28.10.1988. H.3 Vortragsreihe B, technische und angewandte Informatik/Computertechnik 1988 / p. 11-14

Test pattern generation for microprocessor systems on the alternative graph model

Ubar, Raimund-Johannes Proceedings of the 3rd Symposium of the IMEKO Technical Committee on Technical Diagnostics (TC10), held in Moscow, October 3 - 5, 1983 1985 / p. 403-410

Test program generation for microprocessor systems

Dušina, Julia 1993 https://www.ester.ee/record=b2090526*est

Test system for fault detection and diagnosis in microprocessor control devices

Ubar, Raimund-Johannes; Lohuaru, Tõnu; Männisalu, Mati; Pukk, P.; Vanamölder, E. Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1990 / lk. 63-77: ill

Testentwicklung für Mikroprozessorsystem mit Hilfe der alternativen Graphen

Alango, Villem; **Kont, Toomas**; **Ubar, Raimund-Johannes** 33. Internationales wissenschaftliches Kolloquium : 24.-28.10.1988. H.1. 1988 / S- 11-14 https://www.ester.ee/record=b2936968*est

Traction and control of light rail vehicles

Laugis, Juhan; **Lehtla, Tõnu**; **Joller, Jüri**; **Rosin, Argo**; **Vinnikov, Dmitri**; **Lehtla, Madis** 2008 http://www.ester.ee/record=b2394449*est

Transmeta protsessorite nišš

Tammemäe, Kalle A & A 2000 / 3, lk. 7-13 : ill https://artiklid.elnet.ee/record=b1004180*est

Unustusehõlma vajunud mikroprotsessorid 4005 ja MF7114

Toomsalu, Arvo A & A 2011 / lk. 8-17 : ill

Valuroboti mikroprotsessorjuhtimisega manipulaatori uurimine : elektriseadmed : magistritöö

Kulmar, Lembit 1992 https://www.ester.ee/record=b2630339*est

Автоматизированное построение программ самодиагностики микропроцессоров

Storožev, Sergei Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1990 / lk. 90-97: ill

Анализ методов тестирования микропроцессоров

Toomsalu, Arvo Синтез и диагностика цифровых устройств и систем 1982 / с. 53-62

Анализатор кислорода с микропроцессором

Ots, Avo; **Jäetma, Teet**; **Marvet, Rein** Электрохимические средства анализа и охрана окружающей среды : тезисы докладов

всесоюзной конференции, 25-27 июня 1989 г 1989 / с. 111-113 : илл https://www.ester.ee/record=b1208856*est

Влияние микропроцессора на чувствительность векторвольтметров

Logunov, Gennadi; Sillamaa, Hanno Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции, посвященной Дню радио, октябрь 1983. Секция "Микропроцессорная техника" 1983 / с. 8-10 https://www.ester.ee/record=b1295287*est

Выбор структуры микропроцессорной системы для векторного вольтметра

Logunov, Gennadi; Roi, Mihhail Вопросы теории и проектирования электронных вольтметров и средств их проверки : тезисы докладов республиканской научно-технической конференции, [17-18 сентября 1985 года, Таллин] 1985 / с. 64-65 https://www.ester.ee/record=b1255402*est

Генерирование тестов для микропроцессорных систем

Aasma, M.; Kõlamets, A. XXVII студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик, Белорусской ССР и Молдавской ССР, 19-21 апреля 1983 г : тезисы докладов. Часть 2 1983 / с. 14 https://www.ester.ee/record=b1571566*est

Генерирование тестов микропроцессорных систем на модели АГ

Ubar, Raimund-Johannes Техническая диагностика : Тезисы докладов III Международного симпозиума ИМЕКО, Москва, окт. 1983 1983 / с. 100-103

Декомпозиционный синтез управляющих автоматов на программируемых матрицах и микропроцессорах : автореферат ... кандидата технических наук (05.13.01)

Sudnitsõn, Aleksander 1983 https://www.ester.ee/record=b1291157*est

Декомпозиционный синтез управляющих автоматов на программируемых матрицах и микропроцессорах : диссертация на соискание ученой степени кандидата кандидата технических наук

Sudnitsõn, Aleksander 1983 https://www.ester.ee/record=b4634419*est

Декомпозиция микропрограммных автоматов на микропроцессоры

Keevallik, Andres; Sudnitsõn, Aleksander Синтез управляющих устройств на основе микропроцессов и однородных сред : труды II всесоюзного семинара, Рязань, дек. 1979 г. 1980 / с. 16-20 https://www.ester.ee/record=b2632002*est

Макет привода с векторным управлением

Boiko, Vitali Symposium "Topical Problems of Education in the Field of Electrical and Power Engineering" : Kuressaare, Estonia, January 19-24, 2004 2004 / p. 66-68 : ill

Микропроцессорная система управления двухдвигательным магнитогидродинамическим приводом

Laugis, Juhan; Oorn, Hillar; Oorn, Arvo Проблемы оптимизации работы автоматизированных электроприводов 1986 / с. 135-136

Микропроцессорная система электропривода постоянного тока

Блумберг Э.А. Тезисы докладов семинара "Новые разновидности электропривода и возможности их применения" 1990 / с. 51-54: илл

Микропроцессорные системы : учебно-методическое пособие

1983 https://www.ester.ee/record=b1241140*est

Микропроцессорный измеритель амплитуды и задержки перекрывающихся импульсов

Arro, Ilmar; Ots, Avo; Sullakatko, Toomas; Heinrichsen, Vladimir Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции, посвященной Дню радио. Секция "Системы реального времени" 1980 https://www.ester.ee/record=b1304214*est

Микропроцессорный измеритель параметров гармонического сигнала

Ots, Avo; Trump, Tõnu Методы и устройства регистрации, передачи, обработки и представления информации 1986 / с. 69-71

Микропроцессоры сегодня и завтра : [статьи]

Keevallik, Andres; Leppik, K.; Kallas, E. Советская Эстония 1985 / с. [?] https://www.ester.ee/record=b1447330*est

О синтезе тестов для микропроцессорных БИС

Lohuaru, Tõnu; Ubar, Raimund-Johannes Проектирование и диагностика вычислительных средств 1987 / с. 30-42 : илл https://www.ester.ee/record=b1273275*est

Обеспечение адаптивности векторного анализатора к свойствам входных сигналов при помощи встроенного микропроцессора

Min, Mart; Ronk, Ants; Haldre, Eero Всесоюзная научно-техническая конференция «Проблемы развития аппаратных и программных средств вычислительной техники для машинного моделирования»: тезисы докладов 1987 / с. 102

Один подход к автоматизации проектирования микропроцессорных систем дискретного управления
Keevallik, Andres; Berkman, Boriss; Sudnitsõn, Aleksander Микропроцессорные системы обработки информации и управления : тезисы докладов 1987 / с. ?

Применение методов декомпозиции конечных автоматов для построения сетей микропроцессоров
Keevallik, Andres; Sudnitsõn, Aleksander Синтез управляющих устройств на основе микропроцессов и однородных сред : труды II всесоюзного семинара, Рязань, дек. 1979 г. 1980 / с. [?] https://www.ester.ee/record=b2632002*est

Применение микроконтроллера MSP430 в качестве тренировочного микропроцессорного устройства
Galkin, Ilja; Skarainis, M.; Laugis, Juhan; Lehtla, Tõnu Технічна електродинаміка 2005 / 2, с. 90-93 : ил

Применение микропроцессора 8085А в учебном процессе
Siimar, Veiko Тезисы докладов семинара "Новые направления научных исследований в области электромеханики" 1991 / с. 46-47

Применение модели АГ для автоматизации синтеза тест-программ микропроцессорных БИС
Ubar, Raimund-Johannes Электронная техника. Серия 8, Управление качеством, стандардизация, метрология, испытания : научно-технический сборник 1985 / с. 110-113 https://www.ester.ee/record=b2160764*est

Программная реализация элементарных функций микропроцессорной системой векторного вольтметра
Logunov, Gennadi; Roi, Mihhail Вопросы теории и проектирования электронных вольтметров и средств их проверки : тезисы докладов республиканской научно-технической конференции, [17-18 сентября 1985 года, Таллин] 1985 / с. 53-54 https://www.ester.ee/record=b1255402*est

Проектирование диагностических тестов для микропроцессорных БИС и систем
Einasto, N.; Ubar, Raimund-Johannes XXX студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик, Белорусской ССР и Молдавской ССР, 8-10 апреля 1986 года : тезисы докладов. Том II, Автоматика. Энергетика. Механика. Химия 1986 / с. 40 https://www.ester.ee/record=b1305565*est

Распараллеливание и сетевые реализации конечно-автоматных алгоритмов управления
Keevallik, Andres Пятая всесоюзная школа-семинар "Распараллеливание обработки информации" : тезисы доклады и сообщения 1985 / с. 63-64

Синтез мультимикропроцессорных систем дискретного управления
Keevallik, Andres; Sudnitsõn, Aleksander; Berkman, Boriss Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции, посвященной Дню радио, октябрь 1983. Секция "Микропроцессорная техника" 1983 / с. 10-12 https://www.ester.ee/record=b1295287*est

Система генерирования тестов для микропроцессоров
Ubar, Raimund-Johannes; Dušina, Julia; Zaugarov, Viktor; Крупнова Е.; Storožev, Sergei Proceedings of international conference "Technical Diagnostics-93", St.-Peterburg, June 8-10, 1993 1993 / p. 87-89

Схема пошагового выполнения программ отладки микропроцессора
Logunov, Gennadi; Roi, Mihhail XXV студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик, Белорусской ССР и Молдавской ССР, 21-23 апреля 1981 года : тезисы докладов. Том 2, Автоматика. Энергетика. Механика. Химия 1981 / с. 43-44 https://www.ester.ee/record=b1322629*est

Улучшение технических показателей векторвольтметра ТВ5-85 с помощью встроенной микропроцессорной системы
Logunov, Gennadi; Roi, Mihhail Вопросы теории и проектирования электронных вольтметров и средств их проверки : тезисы докладов республиканской научно-технической конференции, [17-18 сентября 1985 года, Таллин] 1985 / с. 54 https://www.ester.ee/record=b1255402*est

Формальный синтез тестов для микропроцессоров
Toomsalu, Arvo; Ubar, Raimund-Johannes XVII областная научно-техническая конференция по вопросам повышения эффективности и качества систем и средств управления (май 1981 г.): Тезисы докладов 1981 / с. 111-112